

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (ミリオームハイテスタ <mΩ HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3540)
 製造番号<Serial No.> (No. 1303xxxx)
 検査年月日<Test Date> (2019-01-01)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	(標準器校正値) <Std. Cal. Value>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
確度<Accuracy>					
電源周波数<Supply frequency>60Hz, サンプリング<Sampling>FAST					
30kΩ	30.00kΩ	(30.00 kΩ)	29.90 kΩ	~ 30.10 kΩ	(30.00 kΩ)
3kΩ	3.000kΩ	(3.000 kΩ)	2.990 kΩ	~ 3.010 kΩ	(3.000 kΩ)
300 Ω	300.0 Ω	(300.0 Ω)	299.0 Ω	~ 301.0 Ω	(300.0 Ω)
30 Ω	30.00 Ω	(30.00 Ω)	29.90 Ω	~ 30.10 Ω	(30.00 Ω)
3 Ω	3.000 Ω	(3.000 Ω)	2.988 Ω	~ 3.012 Ω	(3.000 Ω)
300mΩ	300.0mΩ	(300.0 mΩ)	299.0 mΩ	~ 301.0 mΩ	(300.0 mΩ)
30mΩ	30.00mΩ	(30.00 mΩ)	29.88 mΩ	~ 30.12 mΩ	(30.00 mΩ)
電源周波数<Supply frequency>60Hz, サンプリング<Sampling>SLOW					
30kΩ	30.00kΩ	(30.00 kΩ)	29.93 kΩ	~ 30.07 kΩ	(30.00 kΩ)
3kΩ	3.000kΩ	(3.000 kΩ)	2.993 kΩ	~ 3.007 kΩ	(3.000 kΩ)
300 Ω	300.0 Ω	(300.0 Ω)	299.3 Ω	~ 300.7 Ω	(300.0 Ω)
30 Ω	30.00 Ω	(30.00 Ω)	29.93 Ω	~ 30.07 Ω	(30.00 Ω)
3 Ω	3.000 Ω	(3.000 Ω)	2.991 Ω	~ 3.009 Ω	(3.000 Ω)
300mΩ	300.0mΩ	(300.0 mΩ)	299.3 mΩ	~ 300.7 mΩ	(300.0 mΩ)
30mΩ	30.00mΩ	(30.00 mΩ)	29.91 mΩ	~ 30.09 mΩ	(30.00 mΩ)
温度<Temperature>	75.0 °C	(75.0 °C)	74.8 °C	~ 75.2 °C	(75.0 °C)
※	25.0 °C	(25.0 °C)	24.8 °C	~ 25.2 °C	(25.0 °C)
	0.0 °C	(0.0 °C)	-0.2 °C	~ 0.2 °C	(0.0 °C)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。
 <The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>

※温度検査では、校正された抵抗による擬似入力で検査しています。
 <For the temperature test points, inspection is conducted using calibrated resistances that simulate the conditions corresponding to each temperature.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.3540-8A